精选快讯　硬件快讯　2026年11月16日 17:24

万润半导体参与编制的NAND闪存寿命试验国家标准正式发布

要点

- 万润半导体参与编制的国家标准《NAND型闪存存储器寿命试验方法》（GB/T48295-2026）正式发布。
- 在标准制定过程中，万润半导体存储器测试技术团队开展了多轮实验验证，深度参与了标准研讨、测试方法验证及条款完善工作。

万润半导体参与编制的国家标准《NAND型闪存存储器寿命试验方法》（GB/T48295-2026）正式发布。该标准由全国信息技术标准化技术委员会归口，办公机器、外围设备和耗材分会具体执行，将于2027年5月1日起正式实施。

在标准制定过程中，万润半导体存储器测试技术团队开展了多轮实验验证，深度参与了标准研讨、测试方法验证及条款完善工作。作为专注于半导体存储器赛道的企业，万润半导体重点布局消费级、工业级、企业级和车规级存储领域，此次参与国家标准编制体现了其在NAND闪存测试技术领域的专业积累。

报道来源：10jqka
来源网站：https://www.inews.today/